

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
24 février 2005 (24.02.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2005/016842 A2

(51) Classification internationale des brevets⁷ : C03C 17/34

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2004/050359

(22) Date de dépôt international : 27 juillet 2004 (27.07.2004)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
0309900 13 août 2003 (13.08.2003) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : SAINT-
GOBAIN GLASS FRANCE [FR/FR]; 18, Avenue d'Al-
sace, F-92400 Courbevoie (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : FLEURY,
Carinne [FR/FR]; 25, Avenue Jean Moulin, F-75014 Paris
(FR). NADAUD, Nicolas [FR/FR]; 63, Avenue Pasteur,
F-94250 Gentilly (FR). BELLJOT, Sylvain [FR/FR]; 28,
Rue du Colonel Rozanoff, F-75012 Paris (FR).

(74) Mandataire : SAINT-GOBAIN RECHERCHE; 39,
Quai Lucien Lefranc, F-93300 Aubervilliers (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,
MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH,
PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),
européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI,
SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

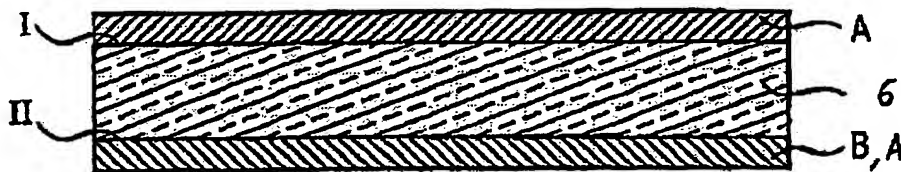
Publiée :

— sans rapport de recherche internationale, sera republiée
dès réception de ce rapport

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abrévia-
tions, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et
abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de
la Gazette du PCT.

(54) Title: TRANSPARENT SUBSTRATE COMPRISING AN ANTIREFLECTION COATING

(54) Titre : SUBSTRAT TRANSPARENT COMPORTANT UN REVETEMENT ANTIREFLET



in that the stack comprises successively: a first layer (1) with refractive index n_1 ranging between 1.8 and 2.3 and a geometrical thickness e_1 ranging between 5 and 50 nm; a second layer (2) with refractive index n_2 ranging between 1.35 and 1.65 and geometrical thickness e_2 ranging between 5 and 50 nm; a third layer (3) with refractive index n_3 ranging between 1.8 and 2.3 and geometrical thickness e_3 ranging between 40 and 150 nm; a fourth layer (4) with refractive index n_4 ranging between 1.35 and 1.65 and geometrical thickness e_4 ranging between 40 and 150 nm.

(57) Abstract: The invention
concerns a transparent substrate
(6) comprising on at least one
of its surfaces an antireflection
coating, in particular with normal
incidence consisting of a stack
(A) of thin layers, characterized

(57) Abrégé : Substrat transparent (6) comportant sur au moins une de ses faces un revêtement antireflet, notamment à incidence normale fait d'un empilement (A) de couches minces, caractérisé en ce que l'empilement comporte successivement : -une première couche (1) d'indice de réfraction n_1 compris entre 1,8 et 2,3 et d'épaisseur géométrique e_1 comprise entre 5 et 50 nm, -une seconde couche (2) d'indice de réfraction n_2 compris entre 1,35 et 1,65 et d'épaisseur géométrique e_2 comprise entre 5 et 50 nm, -une troisième couche (3) d'indice de réfraction n_3 compris entre 1,8 et 2,3 et d'épaisseur géométrique e_3 comprise entre 40 et 150 nm, - une quatrième couche (4) d'indice de réfraction n_4 compris entre 1,35 et 1,65 et d'épaisseur géométrique e_4 comprise entre 40 et 150 nm.

WO 2005/016842 A2